

CISRiC

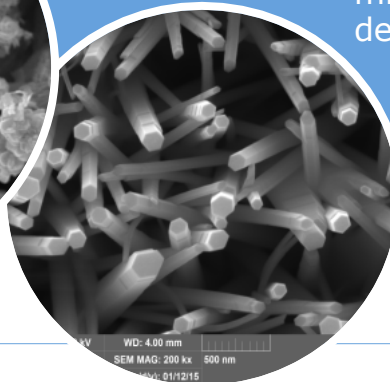
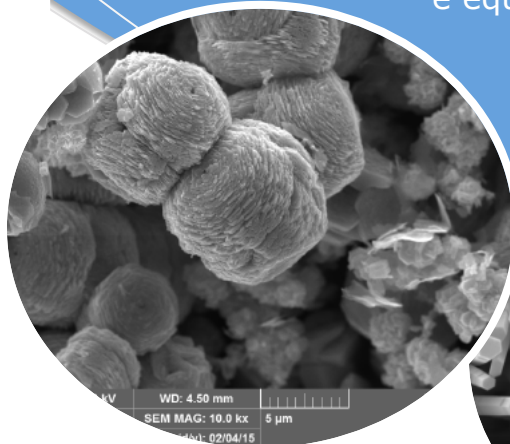
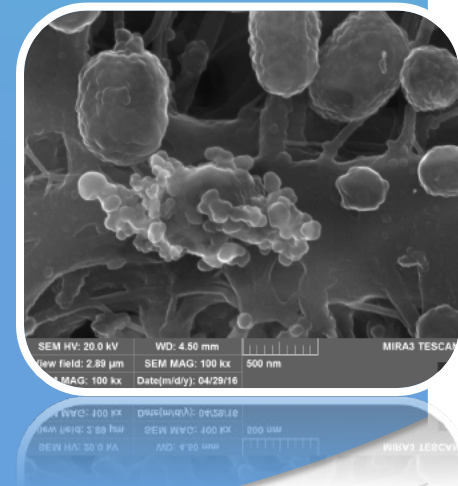
*Centro Interdipartimentale
di Studi e Ricerche
per la Conservazione del Patrimonio Culturale*

*Laboratorio Arvedi
diagnostica e conservazione di supporti lignei,
manufatti policromi e strumenti musicali*

Servizio di Microscopia Elettronica

Il Centro mette al servizio delle Aziende
le proprie apparecchiature scientifiche
presso il Laboratorio Arvedi di Pavia.

Il Laboratorio di Microscopia Elettronica a Scansione
è equipaggiato con un moderno FE-SEM ad alta risoluzione
della serie Tescan Mira3, in grado di produrre
imaging di altissima qualità con ingrandimenti
sino a 500 Kx. Vengono inoltre effettuate
microanalisi semi-quantitative
della composizione, mappature
e analisi della struttura
cristallografica.



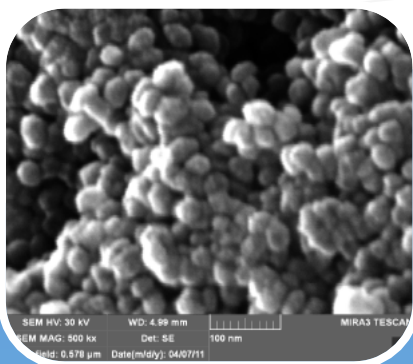
CISRiC Arvedi PV

Via Ferrata, 1 – 27100 Pavia
e-mail: cisric.arvediPV@unipv.it. Skype: CISRiC
<http://cisric.unipv.it>

Accesso al servizio e tariffe

Per richieste multiple o continuative sono previste riduzioni, da concordarsi in base alla domanda, rispetto al tariffario di massima qui riportato. L'accesso avviene tramite invio dell'apposito modulo all'indirizzo cisric.arvediPV@unipv.it. Il personale del laboratorio offrirà qualsiasi delucidazione via mail o Skype, anche tramite videocall. Il contatto telefonico verrà in seguito fornito via mail/Skype. Modulo di richiesta editabile e tariffario completo scaricabili al link: <http://cisric.unipv.it/index.php/servizi>

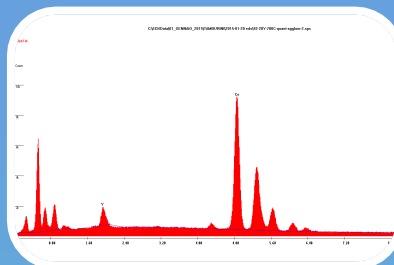
Servizi	Costi (IVA escl.)
Osservazione al SEM	150 €/h
Microanalisi EDS o EBSD + Osservazione al SEM	170 €/h



Imaging ad altissima risoluzione

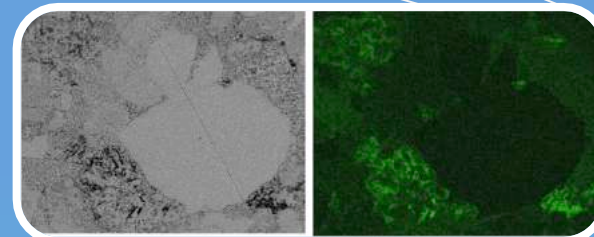
Rispetto a quanto ottenuto con le più comuni sorgenti a filamento, grazie alla sorgente a emissione di campo le prestazioni sono molto più elevate. In modalità In-Beam è possibile raggiungere risoluzioni dell'ordine del nanometro. Immagini di altissima qualità fino a 500 K_x, utili per la caratterizzazione nanostrutturale di materiali ceramici, metallici, compositi.

Servizi svolti



Micronalisi EDS

Tramite la microsonda è possibile ottenere un'analisi semiquantitativa della composizione chimica del campione. La tecnica (EDS, Energy dispersion spectroscopy) sfrutta i raggi X emessi dal campione colpito dal fascio di elettroni.



Mappature

È possibile mappare la distribuzione degli atomi presenti nel campione, ottenendo immagini in falsi colori con scale di intensità relazionate al contenuto dell'atomo di interesse.

Tramite analisi **EBSD** (Electron backscatter diffraction) è possibile ottenere una mappatura microstrutturale-cristallografica, visualizzando i bordi grano dei materiali e l'orientazione della struttura cristallina. Utile per studiare difetti, fasi e interfacce.

